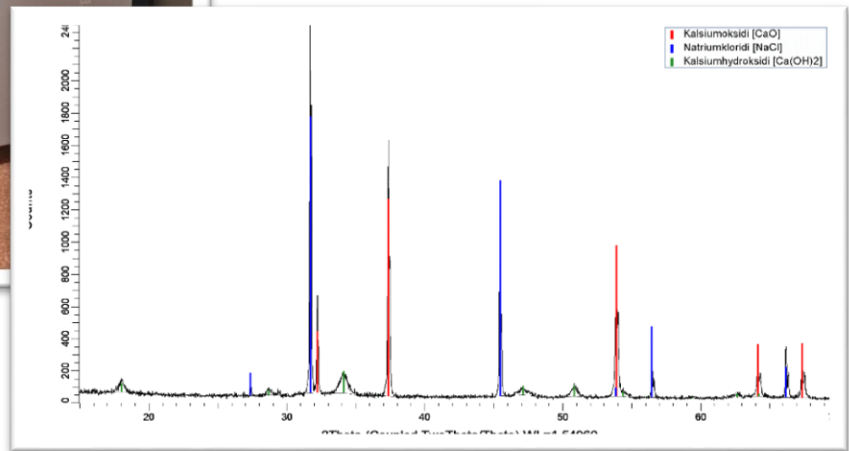
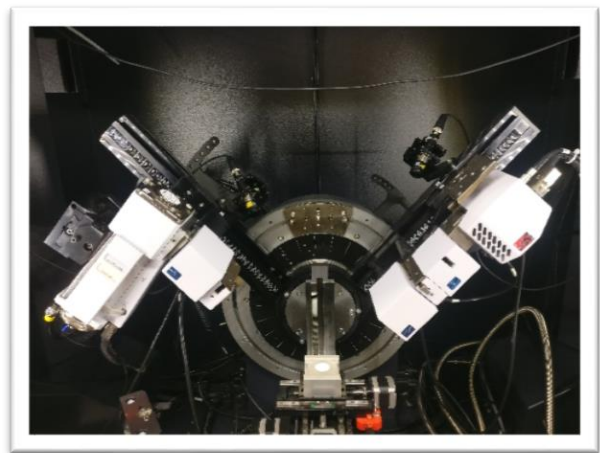


# Jauheröntgendiffraktio (XRPD)

- Kiteisten faasien tunnistus monikiteisestä näytteestä (jauhemainen tai kiinteä).
- Faasien suhteellisten massaosuuksien määrittäminen Rietveld-hienonnuksella.
- Kidekoon määrittäminen Scherrer-yhtälöllä.
- Pintojen ja pinnoitteiden tutkimus GID-menetelmällä.
- Raportointi sopimuksen mukaan.



## YHTEYSTIEDOT:

Prof. Vesa-Pekka Lehto

Itä-Suomen yliopisto / Sovelletun fysiikan laitos

E-mail: vplehto@uef.fi

p. 040-3552470

<http://www.materiakeskus.fi>